

DIN EN ISO 3882:2003-10 (D)

Metallische und andere anorganische Überzüge - Übersicht über Verfahren zur Schichtdickenmessung (ISO 3882:2003); Deutsche Fassung EN ISO 3882:2003

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Zerstörungsfreie Verfahren	5
4.1 Lichtschnittverfahren, ISO 2128	5
4.2 Magnetische Verfahren, ISO 2178 und ISO 2361	5
4.3 Wirbelstromverfahren, ISO 2360	6
4.4 Röntgenspektrometrische Verfahren, ISO 3497	6
4.5 Betarückstreuverfahren, ISO 3543	7
5 Zerstörende Verfahren	7
5.1 Mikroskopisches (optisches) Verfahren, ISO 1463	7
5.2 Mehrstrahlinterferometrisches Verfahren nach Fizeau, ISO 3868	7
5.3 Profilometrisches Verfahren (Tasterverfahren), ISO 4518	7
5.4 Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop, ISO 9220	8
5.5 Auflösungsverfahren	8
5.5.1 Coulometrisches Verfahren, ISO 2177	8
5.5.2 Gravimetrisches Verfahren (Auflösen und Wägen), ISO 10111	8
5.5.3 Gravimetrisches (analytisches) Verfahren, ISO 10111	8
Literaturhinweise	12
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	13